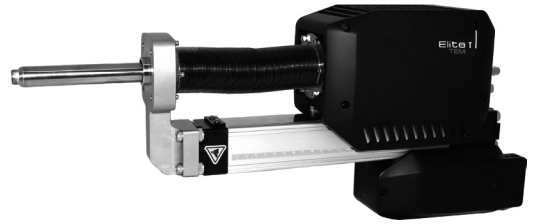




Smart analysis for smart results

Elite T EDS system

- TEM/STEMに最適化したウィンドウレスSDD検出器
- デュアル検出器にも対応。更に立体角を最大化可能
- ウィンドウレス検出器としては最大の160mm²をラインナップ



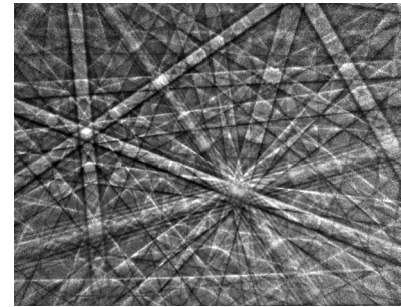
Velocity EBSD camera

- 最大4,500点/秒の測定スピード。
- SEM生産性の向上、In-situ実験、3D EBSDに最適
- 高速EDS-EBSD同時分析。EDAX EDS検出器との組合せに最適化



Clarity EBSD camera New

- 標準型EBSDジオメトリで世界初の直接検出型EBSD検出器
- 蛍光スクリーンとレンズシステムを無くし、ひずみのないEBSDパターン
- ビームセンシティブなサンプルのEBSD分析を実現



edax.co.jp



Redefining what's possible

K3 IS Camera

K3™IS – その場TEM観察のために開発された、世界初の電子カウンティング、高速、高精細カメラです。

- 電子線照射に伴うアーティファクトではない、真の試料の状態が観察可能
- 卓越した速度で電子をカウンティング
 - センサー全視野で150 フレーム毎秒を実現
 - 256×256ピクセルで3500 フレーム毎秒以上を達成
- 観察視野を14メガピクセル、または24メガピクセルまで拡大、K2 ISカメラ比最大1.65倍



gatan.com/jp

The Power of Ametek

アメテック株式会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー3F
Tel: 03-4400-2300 Fax: 03-4400-2301

AMETEK®

MATERIALS ANALYSIS DIVISION

アメテック株式会社は、2次イオン質量分析装置 (SIMS)、電子線マイクロアナライザー (EPMA)、低エネルギー電子線励起X線分光法 (LeXes) およびアトムプローブトモグラフィー (ATP) の世界的リーダーであると共に、エネルギー分散型X線分析装置 (EDS) や波長分散型X線分析装置 (WDS)、そして後方散乱電子回折 (EBSD)、および微小部蛍光X線分析装置 (μ XRF) などの革新的な材料特性解析システムを提供して参りました。また、除振台、磁場キャンセラー、防音装置等、装置の性能を高めるオプションも準備しております。

新たにガタン社の試料作製装置、デジタルイメージング、そしてエネルギー損失分光器 (EELS) が加わることで、材料をナノスケールで探求するためのトータルソリューションを提供します。

